

Научный совет ОНИТ РАН «Фундаментальные проблемы элементной базы информационно-вычислительных и управляющих систем и материалов для ее создания»  
(научный руководитель — академик РАН Г.Я. Красников)

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

по теме: «Развитие методов диагностики материалов и элементной базы»

Чт. 25 ноября 2021 г., здание РАН (г. Москва, Ленинский пр-т, 32А, Синий зал)

- 10:00- академик РАН Красников Геннадий Яковлевич (АО «НИИМЭ»). Открытие заседания.  
10:10
- 10:10- (1) д.ф.-м.н. Непомнящих Александр Иосифович (ИГХ СО РАН). Диагностика UMG  
10:40 мультикристаллического кремния для солнечной энергетики.  
10:40- (2) **онлайн** к.ф.-м.н. Кобелева Светлана Петровна (НИТУ «МИСиС»). Определение  
11:10 отклонения от стехиометрии в А2В6 по составу равновесной паровой фазы.  
11:10- (3) д.ф.-м.н. Рошупкин Дмитрий Валентинович (ИПТМ РАН). Рентгеновские методы  
11:40 диагностики материалов и элементной компонентной базы микро- и нанoeлектроники.  
11:40- (4) д.ф.-м.н. Якимов Евгений Борисович (ИПТМ РАН). Характеризация  
12:10 полупроводниковых материалов Si, SiC, GaN, Ga2O3 методами РЭМ.  
12:10- (5) к.х.н. Карандашев Василий Константинович (ИПТМ РАН). Масс-спектрометрия с  
12:40 индуктивно связанной плазмой в анализе чистых веществ и материалов.  
12:40- (6) д.ф.-м.н. Осипов Андрей Викторович, д.ф.-м.н. Кукушкин Сергей Арсеньевич  
13:10 (ИПМаш РАН). Методы диагностики эпитаксиального карбида кремния на кремнии  
как нового материала для спинтроники.
- 13:10- (7) д.т.н. Мальцев Петр Павлович (ИСВЧПЭ РАН), Сарайкин Владимир Васильевич  
13:40 (ИСВЧПЭ РАН; НИЦ «Курчатовский институт» – НИИФП им. Ф.В. Лукина»; НИЦ  
«Курчатовский Институт» - ИТЭФ). Предложение по разработке масс-спектрометра  
нового типа с использованием синхротронного излучения.
- 13:40- (8) Маркин Александр Викторович, Глинский Андрей Сергеевич, Тубольцева Марина  
14:10 Михайловна (АО «НИИМЭ»). Анализ содержания примесей анионов в высокочистых  
реактивах для микроэлектроники методом ионной хроматографии. Молекулярные  
загрязнения неорганического происхождения в воздухе (ВМЗ) чистых  
производственных помещений. Метод отбора и анализа проб.
- 14:10- (9) к.ф.-м.н. Буряков Арсений Михайлович, д.ф.-м.н. Мишина Елена Дмитриевна,  
14:40 академик РАН Сигов Александр Сергеевич (РТУ МИРЭА). Фемтосекундная оптика  
для диагностики наноматериалов и наноструктур.
- 14:40- (10) д.ф.-м.н. Бычков Евгений Алексеевич (ИПЛИТ РАН – филиал ФНИЦ  
15:10 «Кристаллография и фотоника» РАН). Нейтронная и синхротронная диагностика  
фазоизменяемых материалов нового поколения.
- 15:10- (11) **онлайн** д.ф.-м.н. Терещенко Олег Евгеньевич (ИФП СО РАН). Фотоэмиссия с  
15:40 угловым и спиновым разрешением в изучении квантовых материалов: возможности  
новой фотоэмиссионной установки в ИФП СО РАН и ARPES станции на синхротроне  
СКИФ.
- возможно дополнение (не более 12 докладов)**  
Общая дискуссия. Подведение итогов заседания.

В пронумерованных пунктах включены 10 минут для ответов на вопросы.

Кофе-брейк организован в фойе с 09:30 до 14:00, посещение в свободном порядке.